

Mesure des micro-déplacements dans le plan

Le nouveau système **MYCSYS** de **MITUTOYO** permet la mesure de déplacements dans le plan en visant perpendiculairement à ce plan.

Caractéristiques : Mesures de deux déplacements par corrélation

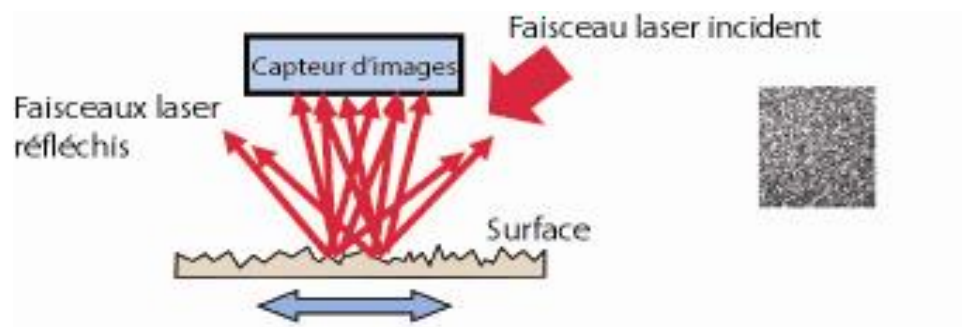
Mesures simultanées des deux directions perpendiculaires X et Y

Résolution de 1 nanomètre

Alignement simple

Principe :

Une diode laser illumine la surface visée et renvoie par réflexion une image appelée « speckle » vers un récepteur. Lorsque la surface visée se déplace en X ou en Y, ce « speckle » se déplace et le récepteur enregistre ces déplacements.



Caractéristiques principales :

Modèle	MICSYS –SA1
Méthode de mesure	corrélation du speckle
Résolution en X et Y	1nm
Etendues de mesure	+/-100µm
Fréquence des mesures	30Hz
Alimentation électrique	220 VAC
Diode laser à	650nm
Interface	RS232C

